DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05567154 **Image available**

ELECTRONIC STILL CAMERA AND METHOD FOR FOCUS-CONTROLLING THE SAME

PUB. NO.: 09-181954 **JP 9181954** A] PUBLISHED: July 11, 1997 (19970711)

INVENTOR(s): OKADA MASAKI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 07-336925 [JP 95336925] FILED: December 25, 1995 (19951225)

INTL CLASS: [6] H04N-005/232; G02B-007/34; G02B-007/36; G02B-007/28;

G03B-013/36

JAPIO CLASS: 44.6 (COMMUNICATION -- Television); 29.1 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Photography & Cinematography); 29.2 (PRECISION

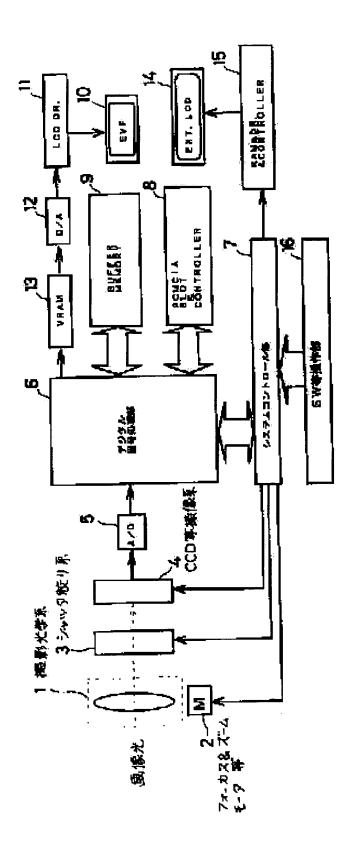
INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD & BBD)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute one shot AF and servo AF of a phase difference detection system without using an AF-only optical system and a sensor by moving an exposure pupil position by giving a time difference and executing pupil time division phase difference AF through the use of obtained exposure and signals.

SOLUTION: One shot AF or servo AF is executed and pupil time division phase difference AF is executed by viewing the state of an operation part 16. A system control part 7 transmits a control signal to a shutter converging system 3 and sets the shutter converging system 3 for pupil convergence for AF. Phase difference AF is executed by giving the time difference, moving the exposure pupil position to right and left by using the signals which are exposed and read. Thus, one shot AF and servo AF of the phase difference detection system can be executed without using the AF-only optical system and the sensor. Thus, more precise AF can be executed in short time by correcting AF of the phase difference detection system with AF of a partial down hill method.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-181954

(43)公開日 平成9年(1997)7月11日

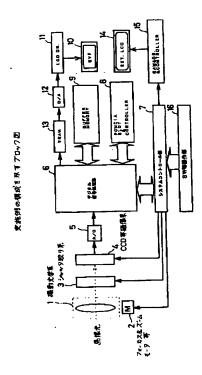
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F -I			技術表示箇所	
H04N 5/23	2		H04N	5/232		Н	
G02B 7/34			G 0 2 B	7/11		С	
7/36						D	
7/28					K		
G 0 3 B 13/36	;			3/00	0 A		
			審査請求	未請求	請求項の数10	OL (全 14 頁)	
(21)出願番号	特顧平7-336925	**	(71) 出顧人	0000010	107		
				キヤノこ	ン株式会社		
(22)出願日	平成7年(1995)12月25日			東京都大	大田区下丸子3	丁目30番2号	
			(72)発明者	岡田 オ	推樹		
					大田区下丸子3 [°] 式会社内	丁目30番2号 キヤ	
			(74)代理人	弁理士	丹羽 宏之	(外1名)	

(54) 【発明の名称】 電子スチルカメラおよびそのフォーカス制御方法

(57)【要約】

【課題】 電子スチルカメラにおいて、AF専用の光学系、センサを用いることなく位相差検出方式のAFシステムを構成する。

【解決手段】 ワンチップAFにおいては、撮影用の撮像系4のCCD出力画像を用いた位相差検出方式オートフォーカス制御と、前記CCDを用いた山登り方式のオートフォーカス制御を行い、サーボAFにおいては、前述の位相差検出方式のオートフォーカス制御を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮影用の撮像素子と、撮影用の光学系 と、この光学系の光軸に対し対称の位置に瞳位置を移動 させる瞳位置移動手段と、この瞳位置移動手段で移動さ せた各瞳位置における前記撮像素子の出力画像を取り込 み、その相関演算によりデフォーカス量を求め、このデ フォーカス量にもとづいて前記光学系のフォーカス制御 を行う第1のフォーカス制御手段と、この第1のフォー カス制御手段によるフォーカス制御に続いて、瞳位置を 前記光学系の光軸位置として前記撮像素子の出力画像を 取り込み、その高周波成分が最大になるように前記光学 系のフォーカス制御を行う第2のフォーカス制御手段 と、前記第1のフォーカス制御手段,第2のフォーカス 制御手段を用いるワンショットAFモードと前記第1の フォーカス制御手段を用いるサーボAFモードとを切り 替えるAFモード切替え手段とを備えたことを特徴とす る電子スチルカメラ。

【請求項2】 第2のフォーカス制御手段は、第1のフォーカス制御手段により移動したフォーカス用レンズの位置を中心にして、光学系の光軸方向の前後所要の範囲の端点から、所定の像面距離分前記フォーカス用レンズを移動する毎に、撮像素子の出力画像を取り込み、その高域周波数成分を抽出する動作を前記所要の範囲の他方の端点まで繰り返し実行し、その繰り返し抽出した高域周波数成分群の最大値を検知し、その最大値を示す位置に前記フォーカス用レンズを移動させるものであることを特徴とする請求項1記載の電子スチルカメラ。

【請求項3】 サーボAFモード時において、第2のフォーカス制御手段を間欠的に用いることを特徴とする請求項1記載の電子スチルカメラ。

【請求項4】 フォーカス制御の時間を計測する計時手段と、この計測手段が所定時間を計測したとき、前記フォーカス制御を中断させ撮影可能状態とする制御手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の電子カメラ。

【請求項5】 ワンショットAFモードにおいて、撮影用の撮像素子の出力画像を用いて位相差検出方式のオートフォーカス制御を行う第1のステップと、前記撮像素子の出力画像を用いて山登り方式のオートフォーカス制御を行う第2のステップとによりフォーカス制御を行い、サーボAFモードにおいて、前記第1のステップによりフォーカス制御を行うことを特徴とする電子スチルカメラのフォーカス制御方法。

【請求項6】 撮像素子からの映像信号を、記録手段によって記録する電子カメラであって、前記撮像素子の露光瞳位置を、レンズ中心に対して、少なくとも2つの領域にそれぞれ同じ量偏移した位置に移動し、時間的に前後して少なくとも2回露光し、そのそれぞれの時間で取り込まれた画像の相関演算により、デフォーカス量を求め、その結果に従って像面を合焦面あるいは合焦面近傍

まで移動する第1のフォーカス制御を行い、該第1のフォーカス制御によって、合焦面近傍に移動した後、前記撮像素子を露光し、その映像信号の高域周波数成分を抽出し、その信号を用いて、レンズを合焦面に移動する第2のフォーカス制御を行う自動合焦装置を備えた電子カメラにおいて、連続して自動焦点調節動作を行う場合には、前記第1のフォーカス制御でレンズを合焦面に移動することを特徴とする電子カメラ。

【請求項7】 請求項6記載の電子カメラにおいて、前記第1のフォーカス制御を終了した後、摄像素子の露光 瞳位置をレンズの光軸中心に移動し、前記第2のフォーカス制御を開始するように構成したことを特徴とする電子カメラ。

【請求項8】 請求項6記載の電子カメラにおいて、前記第1のフォーカス制御により移動した位置を中心にして、光軸方向の前後ある所定の範囲の端点から所定の像面距離分レンズを移動する毎に前記撮像素子からの映像信号を取り込んで、高域周波数成分を抽出する動作を前記所定の範囲の他方の端点まで繰り返し実行し、その繰り返し抽出した高域周波数成分群の最大値を示す位置に前記レンズを移動させるように前記第2のフォーカス制御を行う自動合焦装置を備えたことを特徴とする電子カメラ。

【請求項9】 撮像素子からの映像信号を、記録手段に 記録する電子カメラであって、前記撮像素子の露光瞳位 置を、レンズ中心に対して、少なくとも2つの領域にそ れぞれ同じ量偏移した位置に移動し、時間的に前後して 少なくとも2回露光し、そのそれぞれの時間で取り込ま れた画像の相関演算により、デフォーカス量を求め、そ の結果に従って像面を合焦面あるいは合焦面近傍まで移 動する第1のフォーカス制御を行い、該第1のフォーカ ス制御によって、合焦面近傍に移動した後、前記撮像素 子を露光し、その映像信号の高域周波数成分を抽出し、 その信号を用いて、レンズを合焦面に移動する第2のフ ォーカス制御を行う自動合焦装置を備えた電子カメラに おいて、連続して自動焦点調節動作を行う場合には、前 記第1のフォーカス制御でレンズを合焦面に移動した 後、前記撮像素子を露光して映像信号の高域周波数成分 を抽出してレンズを合焦面に移動する第2のフォーカス 制御を行うことを特徴とする電子カメラ。

【請求項10】 フォーカス制御の動作を起動するスイッチを有し、前記スイッチがONになると同時にスタートするタイマ手段を有し、前記タイマが任意の時間経過後タイムアウトした際には、フォーカス制御動作中、合焦、非合焦にかかわらず、撮影可能状態とすることを特徴とする電子カメラ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CCD等の撮像素子によって撮影される画像を記録媒体に記録する電子ス

チルカメラに関し、特にそのオートフォーカスに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、銀塩フィルムに画像を写す、所謂一眼レフタイプの銀塩カメラにおいては、位相差検出方式の自動合焦装置(AF)が数多くの機種に用いられている。この位相差検出方式のAFシステムは、概略以下のように動作する。

【0003】図10のように、レンズから入射した光は、メインミラーである45度ミラーの後ろに取り付けてある、サブミラーによって、装置下方に反射され、メガネレンズと呼ばれる2次光学系のレンズにより2つの像に分離されて、AFセンサに入射する。そのAFセンサは図11のように並べて配置されていて、その出力は

$$U0 = \sum_{j=1}^{m} \min(A[j],B[j])$$

(min (a,b) はa,bの小さい方の値)

ルゴリズムで行う。

量U0は、

【数1】

[0005]

【0006】と表す。まずこのU0を計算する。次に、 像系と、演算部とレンス 図12のように、A像をAFセンサの1ビットシフトし テムコントロール部と、

U1は、 【0007】

【数2】

$$U1 = \sum_{j=1}^{m} \min(A[j+1],B[j])$$

たデータとB像のデータの相関量U1を計算する。この

【0008】となる。このように1ビットずつシフトした相関量を次々計算する。2像が一致していれば、この相関量は最大値をとるので、その最大値を取るシフト量を求め、その前後のデータから、相関量の真の最大値を補間して求め、そのシフト量をずれ量とする。光学系によってずれ量と像面移動量、所謂デフォーカス量との関係は決まっているのでそのずれ量からデフォーカス量を求める。そのデフォーカス量から、レンズの繰り出し量を求め、レンズを移動し合焦させる。

【0009】この位相差検出方式のAFシステムを、2次元の撮像素子で静止画像を取り込み映像信号を何らかの記録媒体に記録する、所謂電子スチルカメラに使用すると、銀塩フィルムと撮像素子の大きさ(面積)の違いにより、AFセンサの1画素に相当する撮像面の割合が大きくなる、つまり画素が粗くなって、精度が下がるので、AF光学系の倍率を下げたり、AFセンサそのものの大きさ(画素ピッチ等)を小さくする必要が生じる。これらの手法は既に本出願人から提案されている。

【0010】一方、2次元の撮像素子で動画像を取り込んで、その映像信号を出力あるいは何らかの記録媒体に記録する、所謂ビデオカメラでは、山登り方式と呼ばれるAF(コントラスト方式ともいう)が数多くの機種に用いられている。この方式の一種として摂動法がある。このAF法は、概略以下のように動作する。

【0011】構成としては、2次元の撮像素子を含む撮

像系と、演算部とレンズの制御信号発生部とを含むシス テムコントロール部と、光軸方向にレンズを移動させる ためのレンズ制御部を含むレンズ部とから成る。まず撮 像部において画像光を取り込み、それを映像信号にして システムコントロール部へ送り、そこで信号の高周波成 分を抽出する。その抽出信号の最大値を記憶しておい て、レンズをある方向に移動する。その移動が終了する と、同じように画像光を取り込み、高周波成分抽出を行 う。そして、その最大値が記憶してある値よりも大きか ったら、レンズの移動方向が合焦面に近づいていると判 断し、今回の値を記憶し直して、レンズを同じ方向に移 動する。また今回の最大値が前回のものより小さかった ら、レンズの移動方向が合焦面から遠ざかっていると判 断し、今回の値を記憶し直して、レンズを前回と反対方 向に移動させる。そして、レンズの移動終了後、同じよ うに画像光を取り込み、高周波成分抽出、最大値比較を 行い、最終的には合焦面に像面をもっていく。

同図のようになり、合焦状態、前ピン状態、後ピン状態

によって、2像の間隔が違う。この像間隔が合焦状態の

間隔になるように、レンズを移動させてピント合わせを する。そのレンズの移動量、つまり、像面の移動量は2

像の間隔から計算して求める。その計算は次のようなア

【0004】まず、2つのAFセンサの出力をデータとして取り込む。そしてその2つのセンサ出力の相関を取

る。その取り方は、 "MINアルゴリズム" と呼ばれる もので、センサ1のデータをA[1] - A[n]とし、

センサ2のデータをB[1]-B[n]とすると、相関

【0012】図13で説明すると、図の横軸は像面の位置、縦軸は高周波成分の最大値を示しa点を出発点の像面位置、b点を合焦面とすると、まずa点での高周波成分の最大値がAであったとして、次に図の右方向、つまり合焦面に近づく方向にレンズを移動すると、そのa点での高周波成分の最大値はAで、比較するとA<Aとなり、同じ方向にレンズを移動し続ける。そして、何回目かの比較の時、像面位置がb点を過ぎたところ(a″点で最大値はA″)で、A>A″となり、合焦面から遠ざかる方向になったことが判断でき、レンズ移動の方向を反転し、合焦面に像面をもっていく。

【0013】また、山登り方式のAFの他の一種として 試行法(全域スキャン方式が含まれる)がある。構成と しては前述の摂動法と同じである。まず、レンズを至近 端あるいは無限遠端に送り、そこを出発点として、レン ズが移動できる方向に、ある像面間隔で移動させ、撮像 部において画像光を取り込み、それを映像信号にしてシステムコントロール部へ送り、そこで信号の高周波成分を抽出し、その最大値を記憶しておく。この動作を、出発点が至近端であれば無限遠端まで、反対に無限遠端であれば至近端まで、繰り返し行う。そして、記憶した複数の最大値の中での最大値、つまり一番コントラストの高いフォーカス位置を求め、その点に対応したレンズ位置にレンズを移動させる。摂動法と同様、像面位置と高周波成分との関係は、図14のようになり、合焦面はx点となる。基本的には、以上のような動作をする。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】前述の従来例で示したように、銀塩カメラ等に使われている、位相差検出方式のAFシステムを電子スチルカメラに用いる場合、新たなAF光学系やAFセンサを作る必要があり、それらはより精度的に厳しくなるものであり、撮像素子との相対位置の精度に関しても厳しく、経年変化によるずれの影響が大きくなる。また前述したような、ビデオカメラに使われている、山登り方式のAFシステムの場合は、新たな光学系等を作る必要はないが、1回の撮像素子の蓄積,読出し時間が少なくとも1垂直期間かかることや、高域抽出フィルタの演算時間等を考えると、合焦時間が長くなり、シャッタチャンスを逃してしまい、電子スチルカメラのAFシステムとしては使用に耐えない、という問題が生ずる。

【0015】また、動いている被写体にピントを合わせ 続けるサーボAF時には、短時間での合焦が必須とな る。

【0016】本発明は、このような問題を解消するためなされたもので、電子スチルカメラにおいて、AF専用の光学系、センサを用いることなく、位相差検出方式のワンショットAF、サーボAFを行うことを目的とするものである。

【0017】なお、ワンショットAFは、AF完了でAF動作を終了し撮影を待つモードであり、またサーボAFはコンティニュアスAFともいい、撮影開始までAF動作を繰り返すモードで動体撮影に適する。

[0018]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明では、撮影用の光学系、撮像素子を用いて位相差検出方式のAFシステムを構成する。詳しくは電子スチルカメラを次の(1)~(4)のとおりに構成し、また電子スチルカメラのフォーカス制御方法を次の

(5)のとおりに構成し、さらに電子カメラを次の (6)~(10)のとおりに構成する。

【0019】(1)撮影用の撮像素子と、撮影用の光学系と、この光学系の光軸に対し対称の位置に瞳位置を移動させる瞳位置移動手段と、この瞳位置移動手段で移動させた各瞳位置における前記撮像素子の出力画像を取り込み、その相関演算によりデフォーカス量を求め、この

デフォーカス量にもとづいて前記光学系のフォーカス制御を行う第1のフォーカス制御手段と、この第1のフォーカス制御手段によるフォーカス制御に続いて、瞳位置を前記光学系の光軸位置として前記撮像素子の出力画像を取り込み、その高周波成分が最大になるように前記光学系のフォーカス制御を行う第2のフォーカス制御手段と、前記第1のフォーカス制御手段,第2のフォーカス制御手段を用いるワンショットAFモードと前記第1のフォーカス制御手段を用いるサーボAFモードとを切り替えるAFモード切替え手段とを備えた電子スチルカメラ。

【0020】(2)第2のフォーカス制御手段は、第1のフォーカス制御手段により移動したフォーカス用レンズの位置を中心にして、光学系の光軸方向の前後所要の範囲の端点から、所定の像面距離分前記フォーカス用レンズを移動する毎に、撮像素子の出力画像を取り込み、その高周波数成分を抽出する動作を前記所要の範囲の他方の端点まで繰り返し実行し、その繰り返し抽出した高域周波数成分群の最大値を検知し、その最大値を示す位置に前記フォーカス用レンズを移動させるものである前記(1)記載の電子スチルカメラ。

【0021】(3)サーボAFモード時において、第2のフォーカス制御手段を間欠的に用いる前記(1)記載の電子スチルカメラ。

【0022】(4)フォーカス制御の時間を計測する計時手段と、この計測手段が所定時間を計測したとき、前記フォーカス制御を中断させ撮影可能状態とする制御手段を備えた前記(1)ないし(3)のいずれかに記載の電子カメラ。

【0023】(5)ワンショットAFモードにおいて、撮影用の撮像素子の出力画像を用いて位相差検出方式のオートフォーカス制御を行う第1のステップと、前記撮像素子の出力画像を用いて山登り方式のオートフォーカス制御を行う第2のステップとによりフォーカス制御を行い、サーボAFモードにおいて、前記第1のステップによりフォーカス制御を行う電子スチルカメラのフォーカス制御方法。

【0024】(6) 撮像素子からの映像信号を、記録手段によって記録する電子カメラであって、前記撮像素子の露光瞳位置を、レンズ中心に対して、少なくとも2つの領域にそれぞれ同じ量偏移した位置に移動し、時間的に前後して少なくとも2回露光し、そのそれぞれの時間で取り込まれた画像の相関演算により、デフォーカス量を求め、その結果に従って像面を合焦面あるいは合焦面近傍まで移動する第1のフォーカス制御を行い、該第1のフォーカス制御によって、合焦面近傍に移動した後、前記撮像素子を露光し、その映像信号の高域周波数成分を抽出し、その信号を用いて、レンズを合焦面に移動する第2のフォーカス制御を行う自動合焦装置を備えた電子カメラにおいて、連続して自動焦点調節動作を行う場

合には、前記第1のフォーカス制御でレンズを合焦面に 移動する電子カメラ。

【0025】(7)前記(6)記載の電子カメラにおいて、前記第1のフォーカス制御を終了した後、撮像素子の露光瞳位置をレンズの光軸中心に移動し、前記第2のフォーカス制御を開始するように構成した電子カメラ。【0026】(8)前記(6)記載の電子カメラにおいて、前記第1のフォーカス制御により移動した位置を中心にして、光軸方向の前後ある所定の範囲の端点から所定の像面距離分レンズを移動する毎に前記撮像素子からの映像信号を取り込んで、高域周波数成分を抽出する動作を前記所定の範囲の他方の端点まで繰り返し実行し、その繰り返し抽出した高域周波数成分群の最大値を示す位置に前記レンズを移動させるように前記第2のフォーカス制御を行う自動合焦装置を備えた電子カメラ。

【0027】(9)撮像素子からの映像信号を、記録手 段に記録する電子カメラであって、前記撮像素子の露光 瞳位置を、レンズ中心に対して、少なくとも2つの領域 にそれぞれ同じ量偏移した位置に移動し、時間的に前後 して少なくとも2回露光し、そのそれぞれの時間で取り 込まれた画像の相関演算により、デフォーカス量を求 め、その結果に従って像面を合焦面あるいは合焦面近傍 まで移動する第1のフォーカス制御を行い、該第1のフ オーカス制御によって、合焦面近傍に移動した後、前記 撮像素子を露光し、その映像信号の高域周波数成分を抽 出し、その信号を用いて、レンズを合焦面に移動する第 2のフォーカス制御を行う自動合焦装置を備えた電子カ メラにおいて、連続して自動焦点調節動作を行う場合に は、前記第1のフォーカス制御でレンズを合焦面に移動 した後、前記撮像素子を露光して映像信号の高域周波数 成分を抽出してレンズを合焦面に移動する第2のフォー カス制御を行う電子カメラ。

【0028】(10)フォーカス制御の動作を起動するスイッチを有し、前記スイッチがONになると同時にスタートするタイマ手段を有し、前記タイマが任意の時間経過後タイムアウトした際には、フォーカス制御動作中、合焦、非合焦にかかわらず、撮影可能状態とする電子カメラ。

[0029]

【発明の実施の形態】以下本発明を実施例により詳しく 説明する。この実施例は、撮影レンズ中心に対して、左 右に位相差検出方式の瞳位置を設定するものであるが、 これに限らず、任意の方向に瞳位置を設定する形、或は 3個以上の瞳位置を設定する形で実施することができ る。

【0030】また実施例は、映像信号を記録媒体に記録するものであるが、これに限らず、映像信号をラインを介してパソコン等に出力する形で実施することができる

【0031】また実施例は、位相差検出方式のAFを、

山登り方式の一種である試行法で補うものであるが、これに限らず、山登り方式の他の一種である摂動法で補う 形で実施することもできる。

[0032]

【実施例】図1は実施例である"電子スチルカメラ"の 構成を示すブロック図である。図1において、1は画像 光が入力される撮影光学系、2は撮影光学系1のフォー カスレンズおよびズームレンズの移動を行うモータとそ のドライバ部、3は瞳位置移動機構を含むシャッタ絞り 系、4は画像光を光電変換して映像信号にするCCD等 撮像信号処理系、5はその映像信号をデジタル化するA -D変換器、6はA-D変換器5で変換されたデジタル 映像信号の様々なデジタル信号処理を行うデジタル信号 処理部、7はカメラ全体のシステムコントロール部、8 は記録媒体やファンクションカード等と接続されるPC MCIA準拠のスロットとそのコントローラ部、9はデ ジタル映像信号を一時記憶しておく等に使われる、例え ばDRAM等のバッファメモリ、10は電子ビューファ インダー(EVF)、11はそのEVFのドライバ部、 12はドライバ部11ヘアナログ信号を送るためのD-A変換器、13はEVFに表示する画像を保持し、D-A変換器12ヘデジタル信号を出力するVRAM、14 はカメラのモードデータ等の表示をする外部白黒液晶 (EXT. LCD)、15はそのEXT. LCD14の 表示のためのコントローラやドライバ等、16はシャッ タボタンやダイヤル等カメラ外部の操作部である。

【0033】以下、図2,図3,図4のフローチャートを参照し動作を説明する。なお、これらのフローチャートの演算、判断はシステムコントロール部7のCPUにより行われる。

【0034】まず、操作部16のシャッタボタンを半押 し、つまりSW1オンすると(S101, YES)、そ れをシステムコントロール部7が検知して、AF動作を 開始する。まずワンショットAFかサーボAFかを操作 部16の状態を見て(S103)、瞳時分割位相差AF を行う(S104またはS110)。このAFのシーケ ンスフローを図3に示す。まず、システムコントロール 部7はシャッタ絞り系3に制御信号を送り、シャッタ絞 り系3をAF用の瞳絞りに設定する。これは図5(a) のように、撮影用絞り開口径を水平方向に二等分するた めの眼鏡状の穴が光軸(撮影用絞り穴中心)に対称に設 けられたもので、そのどちらかの穴、例えば図の右側の 穴を遮光板で塞ぎ(S11)、レンズの左側の光束だけ をCCD等撮像信号処理系4のCCDに入射するように し、まず露光条件設定のための測光を行う(S12)。 この測光、あるいはAF用データの取り込みのためのデ ータ読出しは、全画面ではなく1部分であり、それを高 速で行う必要がある。

【0035】そのような読出し方は次のようになる。図6にインターライン型CCDの概略図を示す。61が画

素、62が垂直電荷転送素子、64が水平電荷転送素子、65が出力部となっている。画素で光電変換された信号電荷は、垂直電荷転送素子62に送られ、4相駆動パルスφV1、φV2、φV3およびφV4により水平電荷転送素子64は、垂直電荷転送素子62から転送される。水平電荷転送素子64は、垂直電荷転送素子62から転送されて来た水平1列分の信号電荷を2相駆動パルスφH1およびφH2により出力部65に転送し、そこで電圧に変換され出力される。

【0036】図7にCCDの撮像領域の概略図を示す。 本実施例では、読出し動作の高速化のため、必要な読出 し領域のみ通常の速さで読み出し、それ以外は高速に読 み出す掃出し転送を行う。71が、通常通りに読み出す 領域、72および73が、それぞれ前半および後半の高 速掃出し転送領域となっている。 図8はCCDの垂直電 荷転送素子62を4相駆動とした場合の1垂直同期期間 分のタイミングチャートを示している。VDが垂直同期 信号で垂直ブランキング期間をLOW電位で示し、HD が水平同期信号で水平ブランキング期間をLOW電位で 示す。 $\phi V 1$, $\phi V 2$, $\phi V 3$ および $\phi V 4$ が、垂直電 荷転送素子の4相駆動パルス、81および82が、画素 で光電変換された信号電荷を垂直電荷転送素子に転送す る読出しパルスを示している。4相駆動パルスのうち8 3および84は、それぞれ、図7の72および73の領 域部分の垂直電荷転送素子62に読み出された信号電荷 を高速に転送する高速掃出し転送パルスを示している。 このようにして必要な読出し領域以外を高速に掃き出す ことで、部分読出し動作の高速化を行うことができる。 このようにして読み出された部分データで露光条件を設 定し(S14)、AF用の1回目の露光を行う(S1 5)。この時、測光値によっては、低輝度で測距不可能 と判断される時があるが (S13, YES)、その時 は、シーケンスフローとしては示していないが、図5 (b)のような瞳面積が大きな絞り穴を使う。また、他 の手法として、図示していない補助光を発光する手法が ある。その時は、補助光用の露光条件の設定を行い(S 21)、補助光を発光し(S22)、露光を行う。ま た、そして測光時と同様にして高速読出しを行い、その データをカメラ内で記憶する(S23)。次にまたCC Dをリセットして、塞がれていた絞り穴を開放し、もう 片側の絞り穴を塞ぎ、露光条件の設定を行い(S16, S24)、2回目の露光を行う。絞り穴は、1回目に使 用したものと同じ種類すなわち同じ口径のものを使う。 また、1回目の露光の時に補助光を発光している場合 は、2回目も補助光用の露光条件設定を行い、補助光を 発光して露光を行う(S24, S25)。そして、1回 目と同じ様に部分高速読出しを行い、そのデータを取り 込み(S17)、1回目の保持データとの相関演算を行 いデフォーカス量を求める(S18)。演算方法として は、従来からの位相差AFと同じ方法であるが、複数ラ

インをデータとして用いる時は、例えば、各対応したラ イン毎に相関演算を行い、求められた相関値群の平均を 求めたり、或は、相関演算を行う前に複数ラインデータ を上下方向に平均化して1ライン分のデータにしてか ら、その相関演算を行ったりして、デフォーカス量を求 める。そして、求められたデフォーカス量にもとづい て、レンズ (ズームレンズであればそのフォーカスレン ズ、単焦点レンズであればレンズ全体、または前玉等フ ォーカスに関係するレンズを指す、請求項のフォーカス 用レンズに対応する)を光軸方向に移動し(S19)、 AF用瞳絞りを光路から退避させる(S20)。もちろ ん、この退避動作はレンズ移動中でも構わない。以上が 瞳時分割位相差AFの一連の動作である。以上の瞳時分 割位相差AF動作を、サーボAF時には、像面が合焦の 範囲に入るまで行い(S111)、そこでAF動作は終 了し、合焦表示を行い、撮影スタシバイ状態、つまりS W2オン可能状態になる(S107)。

【0037】また、ワンショットAF時には、像面が合焦近傍の範囲に入るまで行う(S105)。この回数は、レンズの初期位置や、合焦近傍の範囲設定値にも左右されるが、レンズの初期位置が合焦近傍にある場合は、1回、その他の場合は少なくとも2回(1回目で合焦近傍までレンズを移動し、2回目で合焦近傍に像面があることを判定)行われる。像面が合焦近傍にあり、且つ合焦面にあると判断されると(S106, YES)、そこでAF動作は終了し、合焦表示を行い、撮影スタンバイ状態、つまりSW2オン可能状態になる(S107)。また一方、像面が合焦近傍にあると判断され、しかし合焦面ではないと判断されると(S106, N0)、次に像面を合焦面へ移動するために部分全域スキャンAFを行う(S114)。

【0038】このAFシーケンスのフローを図4に示 す。これは、従来例で示した、全域スキャンAF(試行 法)をある像面間で部分的に行うもので、概念としては 図9のようになる。 瞳時分割位相差 AFでのレンズ移動 位置をa点とし、それまでのレンズの移動方向が図の右 方向とすると、まずレンズをa点から左に像面距離でA だけ移動させる。そして、そこを出発点として右方向に 像面距離でBずつシフトさせ、それぞれの位置で露光を 行う。それをa点から像面距離でA右の点まで行う。B ずつのシフト位置をR(0), R(1)……R(N), (R(n)-R(n-1)=B, N=2*A/B) & U て、それぞれの位置での最大高周波成分データをM (0), M(1)……M(N)とすると、その最大値デ ータ群の中の最大値を求め、それがM(N¹)とする と、これに対応する像面位置R(N⁻)が一番コントラ ストが高いと判断され、つまりR(N)が合焦面xと なる。

【0039】このような合焦面を見つけるため、図4のフローチャートに示すようなシーケンスをとる。まず、

露光瞳位置をレンズ中心に復帰する(S31)。これ は、瞳時分割位相差AFの時のAF用瞳絞りを光路外に 退避させることを意味する。次に、レンズ位置を現時 点、つまり瞳時分割位相差AFによって移動したレンズ 位置から、それまでの移動方向と逆方向に像面距離A移 動させる(S32)。この移動距離Aとしては、例えば 合焦近傍範囲と同じ距離にする等、スキャンする範囲内 に合焦面が必ず含まれるようにしなければならない。そ して移動後、瞳時分割位相差AFの時と同様に測光を行 う(S33)。これはレンズ移動前でも差し支えない。 この測光結果により、露光条件を設定し(S35)露光 を行う。そして、その蓄積データを読出し、その信号の 高周波成分を抽出し、その最大値を記憶しておく(S3 6)。そして、その後レンズを像面距離 B 移動させる (S37)。この値Bは、本来できるだけ小さい方が精 度としては上がるが、小さければ小さいほどその分露光 回数が多くなり、AF動作の時間が長くなり、AFのシ ステムとしては使用に耐えなくなってしまう。反対にB を大きくしすぎると、当然精度が下がり、これもシステ ムとしては使えなくなってしまう。また、レンズ移動の 速さや、CCDの読出し速度等もかかわってくるので、 一概に決定できるものではなく、そのシステム全体を見 た上で慎重に決める必要がある。次にレンズをB移動さ せた後のレンズ位置がスキャン範囲内かどうかを判定 し、範囲内であると(S38, NO)、CCDの露光か らの一連の動作を繰り返し行う(S40,S35~S3 8)。範囲外になると(S38, YES)そこで一連の 繰り返し動作を中止し、それまでに記憶してある高周波 成分最大値データ群を呼び出し、その中での最大値を求 める。その求まった最大値をとる時の像面位置が合焦面 であると判断されるので、その位置にレンズを移動させ る(S39)。測光結果が低輝度と判断された時は(S 34, YES)、瞳時分割位相差AFの時と同じよう に、補助光用の露光条件の設定を行って(S41)、補 助光を発光した(S42)後に、露光し、一連の動作を 行うようにする(S43、S44)。以上のような動作 を行い、レンズを合焦させ、そこでAF動作は終了し、 合焦表示を行い、撮影スタンバイ状態、つまりSW2オ ン可能状態になる(S107)。

【0040】以上のように、2次元のCCDで画像を取り込んで映像信号にし、それを何らかの記録媒体に記録する、所謂電子スチルカメラのAF動作において、ワンショットAF時には、まず、露光瞳位置を時間差をつけて左右に動かして、それぞれで露光、読み出された信号を使って、位相差AFを行う、瞳時分割位相差AFを行うことによって、新たなAF光学系やAFセンサを設ける必要が無く、また、その瞳時分割位相差AFにより、レンズを合焦近傍まで移動させてAFの粗調整を行う。次にその移動位置の前後、所要の像面距離分を、ある所定の像面ピッチで部分的に全域スキャンして、レンズを

合焦面に移動させてAF微調整を行い、撮影スタンバイ 状態にすることにより、スキャンする範囲を狭くするこ とが可能となり、それに要する時間も短くて済み、AF シーケンス全体の所要時間、つまり合焦時間が長くなる ことを防ぐことができる。

【0041】また、サーボAF時には、露光瞳位置を時間差をつけて左右に動かして、それぞれで露光、読み出された信号を使って位相差AFを行う、瞳時分割位相差AFを行うことによって、新たなAF光学系やAFセンサを設ける必要が無く、その瞳時分割位相差AFにより、レンズを合焦面に移動させて、撮影スタンバイ状態にすることにより、より短時間での合焦が可能となる。【0042】また、サーボAF時にも時々、その合焦位置の前後、所定の像面距離分を、ある所定の像面ピッチで部分的に全域スキャンして、レンズを合焦面に移動させて、撮影スタンバイ状態にすることにより、より高精度の合焦が可能となる。

【0043】なお、図2に示すように、SW1を押した直後にタイマがスタートして(S102)、そのタイマがタイムアウトすると(S108,YESまたはS112,YES)、合焦動作中でも撮影スタンバイ状態(S109またはS113)、つまりSW2オン可能状態になり、被写体の状態が悪くて合焦時間が長くなる場合でも、シャッタチャンスを逃すことなく撮影できる。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、AF専用の光学系、センサを用いることなく、位相差検出方式のワンショットAF、サーボAFを行うことができる。また、この位相差検出方式のAFを部分的な山登り方式のAFで補うことにより、より高精度のAFを短時間で行うことができる。

【0045】また、請求項4記載の発明では、シャッタ チャンスを逃すことなく撮影できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 実施例の構成を示すブロック図
- 【図2】 実施例の基本的シーケンスを示す図
- 【図3】 図2における(a) 瞳時分割位相差AFシーケンスを示すフローチャート
- 【図4】 図2における(b)部分全域スキャンAFシーケンスを示すフローチャート
- 【図5】 実施例で用いる位相差AF用瞳絞りの構成を 示す図
- 【図6】 インターライン型固体撮像素子の概略を示す 図
- 【図7】 固体撮像素子の撮像領域の概略図
- 【図8】 固体撮像素子の垂直電荷転送素子を4相駆動 とした場合の1垂直同期期間分のタイミングチャート
- 【図9】 部分全域スキャン方式によるレンズの像面位置と高周波成分との関係を示す図
- 【図10】 位相差AF光学系の概略的構成を示す図

【図11】 AFセンサとその出力を示す図

【図12】 相関計算 (MINアルゴリズム)の説明図

【図13】 摂動法によるレンズの像面位置と高周波成

分の関係を示す図

【図14】 試行法によるレンズの像面位置と高周波成

分の関係を示す図

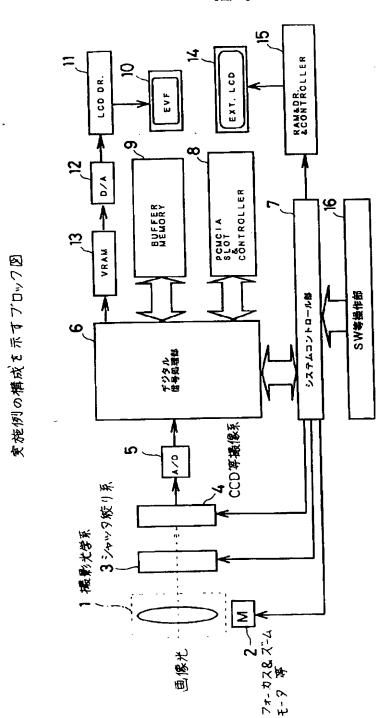
【符号の説明】

1 撮影光学系

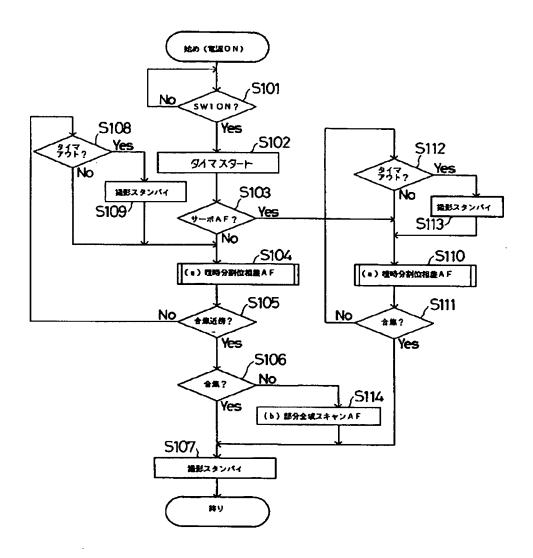
3 シャッタ絞り系

7 システムコントロール部

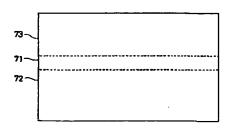
【図1】



【図2】 実**施**刷の基本的シーケンスを示す7<u>ロ</u>ーチャート

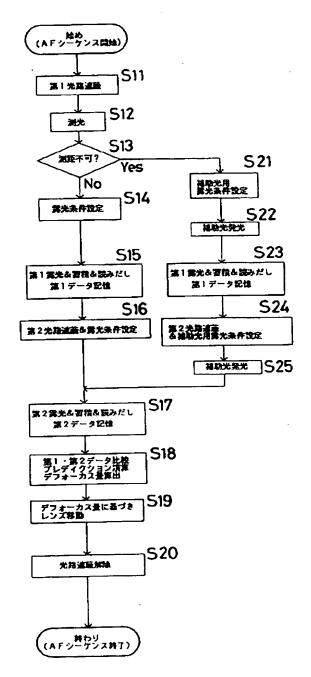


【図7】 国体操像素子の操像領域の概略図

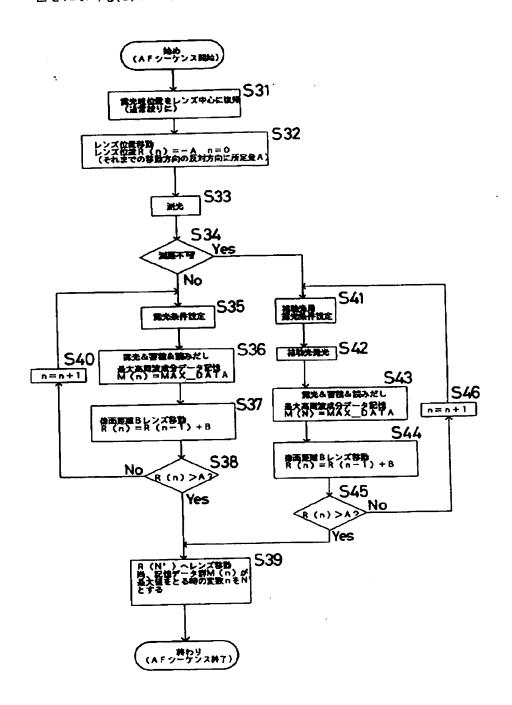


【図3】

図2における(a) 瞳時分割位相差AFシーケンスを示すフローチャート



【図4】 図2における(b)部分全域スキャンAFシーケニスを示すフロ-チャ-ト



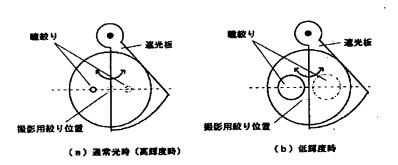
【図5】

【図6】

インタ-ライン型圏体撮影素子の概略意味す図

φV2 0φV3 0-

央施例で用いる位相差AF 用の瞳 絞りの構成を示す図

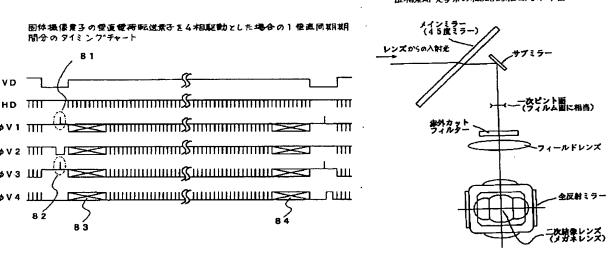


【図8】

位相差AF光学系の概略的構成を示す図

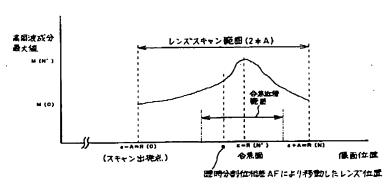
【図10】

φ**Η**1 φ**Η**2



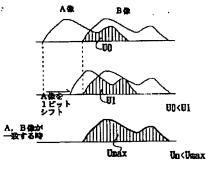
【図9】

部分全域スキャン方式によるレンスの像面位置と高間波成分の 関係を示す図

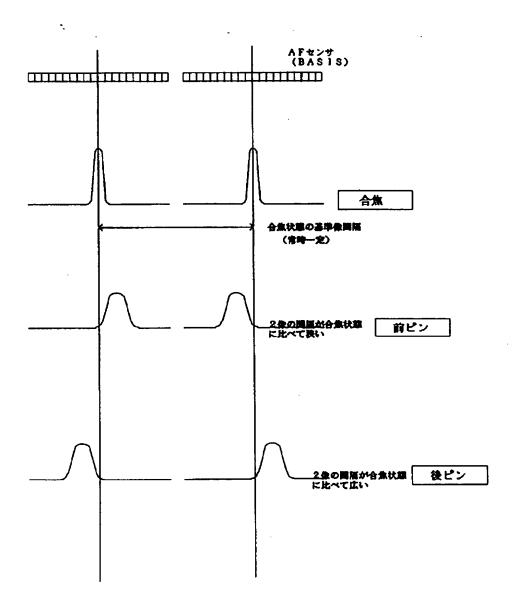


相関計算(MINアルコッパム)の説明図

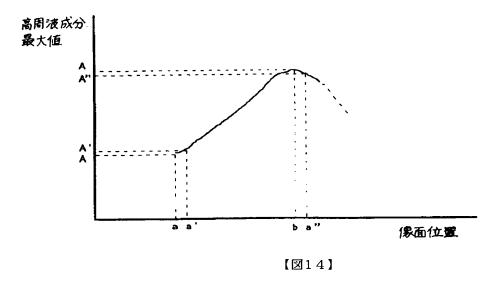
【図12】



【図11】 AF センサとその 出力を 示す 図



【図13】 摂動法によるレンス"の像面位置と高周波成分の関係を示す図



試行法によるレンズの像面位置と高剧波成分の関係

